

0.8mm Pitch Fax Modem Socket
(Advanced Type for Physical Shock)
0.8 ミリ ピッチ ファックス モデム ソケット
(耐衝撃力強化タイプ)

1. 適用範囲

1 Scope :

1.1 内容

1.1 Contents

本規格は0.8ミリ ピッチ ファックス・モデム・ソケットと金フラッシュめっき ファックス・モデム・モジュールとの組み合わせ使用時の製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。
適用製品名と型番は附表1の通りである。

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions of 0.8mm Pitch Fax modem socket Combine to Gold Flash Plating Fax modem module. Applicable product description and part numbers are as shown in Appendix 1.

2. 参考規格類

2. Applicable Documents:

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於いて、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用すること。万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用すること。

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

2.1 AMP 規格

2.1 AMP Specifications :

- A. 109-5000 : 試験法の一般条件
- B. 501-5432 : 試験報告書

- A. 109-5000 Test Specification, General Requirements for Test Methods
- B 501-5432 Test Report

2.2 民間団体規格

2.2 Commercial Standards and Specifications :

- A. MIL-STD-202

- A. MIL-STD-202

3. 一般必要条件

3. Requirements :

3.1 設計と構造

3.1 Design and Construction :

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

3.2 材 料

3.2 Materials :

A. コンタクト

A. Contact :

銅合金

Copper Alloy

仕上げ :

Finish:

接触部 : 金フラッシュめっき

Contact area: Gold Flash

タイン部 : 金フラッシュめっき

Tine area : Gold Flash

下地 : ニッケルめっき

Underplate : Nickel Plated

B.ハウジング

B. Housing :

熱可塑性樹脂UL-94V-0

Thermo plastic UL94V-0

C. ラッチ

C. Latch :

ステンレス、すずめっき

Stainless Steel, Tin Plated

3.3 定 格

3.3 Ratings :

A. 定格電圧 50 VAC

A. Voltage Rating : 50 VAC

B. 定格電流 0.5 A

B. Current Rating : 0.5 A

C. 使用温度範囲 -55°C~85°C

C. Temperature Rating -55°C to 85°C

3.4 性能必要条件と試験方法

3.4 Performance Requirements and Test Descriptions :

製品は Fig. 1 に規定された電氣的、機械的、及び耐環境的性能必要条件に合致するよう設計されていること。試験は特別に規定されない限り室温下で行われること。

The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig. 1. All tests shall be performed in the room temperature, unless otherwise specified.

3.5 性能必要条件と試験方法の要約

3.5 Test Requirements and Procedures Summary

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.1	製品の確認	製品図面の必要条件に合致していること。	目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷を検査する。
3.5.1	Examination of Product	Meets requirements of product drawing	Visual inspection No physical damage
電 気 的 性 能			
Electrical Requirements			
3.5.2	総合抵抗 (ローレベル)	30 mΩ 以下 (初期) ΔR=20 mΩ 以下 (終期)	ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタクトを開路電圧 20 mV 以下、閉路電流 10 mA 以下の条件で隣接間の2回路を一括測定し、その値の1/2を測定値とする。 Fig. 3-1 参照。 AMP 規格 109-5311-1
3.5.2	Termination Resistance (Low Level)	30 mΩ Max. (Initial) ΔR=20 mΩ Max. (Final)	Subject mated contacts assembled in housing to closed circuit current of 10 mA Max. at open circuit voltage of 20mV Max. obtain resistance value by dividing the measured reading into two. Fig. 3-1. AMP Spec. 109-5311-1
3.5.3	耐電圧	沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと。 リーク電流 0.5 mA 以下	0.25 kVAC 1 分間印加 コネクタ嵌合 なし 隣接コンタクト間で測定。 AMP 規格 109-5301
3.5.3	Dielectric withstanding Voltage	No creeping discharge nor flashover shall occur. Current leakage : 0.5 mA Max.	0.25 kVAC for 1 minute. Test between adjacent circuits of unmated connectors. AMP Spec. 109-5301
3.5.4	絶縁抵抗	500MΩ 以上 (初期) 100MΩ 以上 (終期)	500 V DC 印加。 コネクタ嵌合なし 隣接コンタクト間で測定。 AMP 規格 109-5302
3.5.4	Insulation Resistance	500MΩ Min.(Initial) 100MΩ Min.(Final)	Impressed voltage 500 V DC. Test between adjacent circuits of unmated connectors. AMP Spec. 109-5302

Fig.1 (CONT.)

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.5	温度上昇	定格電流 (0.5 A) を通電して、温度上昇は 30 °C 以下。	通電による温度上昇を測定すること。
3.5.5	Temperature Rising	30 °C Max. under loaded specified current (0.5 A)	Measure temperature rising by energized current.
機 械 的 性 能			
Mechanical Requirements			
3.5.6	振動 (低周波)	振動中0.1 μ sec. をこえる不連続導通を生じないこと。 ΔR=20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタに 1.52 mm の振幅で、10-55-10 Hz に毎分 1 サイクルの割合で変化する掃引振動を直交する三方向軸に 2 時間ずつ与えること。 100 mA を通電。 AMP 規格 109-5201
3.5.6	Vibration (Low Frequency)	No electrical discontinuity greater than 0.1 μ sec. shall occur. ΔR=20 mΩ Max. (Final)	Subject mated connectors to 10-55-10 Hz traversed in 1 minute at 1.52 mm amplitude 2 hours each of 3 mutually perpendicular planes. 100 mA applied. AMP Spec. 109-5201
3.5.7	衝撃 (通常試験)	衝撃により 0.1 μ sec. をこえる不連続導通を生じないこと。 ΔR=20 mΩ 以下 (終期)	加速度 : 490 m/s ² (50 G) 衝撃パルス波型 : 正弦半波 接続時間 : 11 m sec. 衝撃回数 : X, Y, Z 軸正逆方向に各3 回宛、合計 18 回 AMP 規格 109-5208 条件 A
3.5.7	Physical Shock (Normal test)	No electrical discontinuity greater than 0.1 μ sec. shall occur. ΔR=20 mΩ Max. (Final)	Accelerated Velocity : 490 m/s ² (50 G) Waveform : Half sine Duration : 11 m sec. Number of Drops : 3 drops each to normal and reversed directions of X, Y and Z axes, totally 18 drops. AMP Spec. 109-5208 Condition A

Fig.1 (CONT.)

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.8	衝撃 (耐久試験)	衝撃により 0.1 μ sec. をこえる不連続導通を生じないこと。 試験後、嵌合基板のラッチからの脱落が無いこと。	加速度 : 7,840 m/s ² (800 G) 衝撃パルス波型 : 正弦半波 接続時間 : 1.1 m sec. モジュール重量 : 20g 衝撃方向 : 指定軸 指定方向に1回 (Fig. 3-2参照)
3.5.8	Physical Shock (Durable test)	No electrical discontinuity greater than 0.1 μ sec. shall occur. No falling off of module board from each connector latches.	Accelerated Velocity : 7,840 m/s ² (800 G) Waveform : Half sine Duration : 1.1 m sec. Module weight : 20g Number of Drops : 1 drop to indicated one direction Fig. 3-2.
3.5.9	基板挿入力	124極: 51.5N (5.3kgf) 以下	操作速度 100 mm/分 挿入に要する力を測定 (本試験には、基板が回転されロックされるまでの力は含まない) AMP 規格 109-5206 条件 B
3.5.9	P.C.Board Mating Force	124pos: 51.5N (5.3kgf) Max.	Operation Speed : 100 mm/min. Measure the force required to mate connectors.(In this test,the force required to turn PCB before it engages on lacking,is excluded.) AMP Spec. 109-5206 Condition B
3.5.10	耐久性 (繰り返し挿抜)	$\Delta R=20$ m Ω 以下 (終期)	基板を挿入した後、回転されロックし、その後ロックを外し基板を取り外す。この操作を50回繰り返す。
3.5.10	Durability (Repeated Mate/Unmating)	$\Delta R=20$ m Ω Max. (Final)	Repeated insertion and extraction of P.C.B to and from the connector with the turns to lock it and then unloocke it for 50 cycles.
3.5.11	はんだ付け性	95 % 以上ぬれていること。	はんだ温度 : 230 \pm 5 $^{\circ}$ C はんだ浸漬時間 : 3 \pm 0.5 秒 使用フラックス : アルファ 100 AMP 規格 109-5203
3.5.11	Solderability	Wet Solder Coverage : 95 % Min.	Solder Temperature : 230 \pm 5 $^{\circ}$ C Immersion Duration : 3 \pm 0.5 seconds Flux : Alpha 100 AMP Spec. 109-5203

Fig.1 (CONT.)

環 境 的 性 能			
Environmental Requirements			
項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.12	リフロー耐熱性	試験後、物理的損傷を生じないこと。	プリント基板に取り付けて試験する。 予熱150~180°C : 60±30秒 加熱230°C以上 : 30±10秒 ピーク温度255°C以下
3.5.12	Resistance to Reflow Soldering Heat	No physical damage shall occur	Test connector on P.C.Board Pre-Heat150~180°C : 60±30sec. Heat 230°C Min. : 30±10sec. Heat Peak255°C Max
3.5.13	熱衝撃	$\Delta R=20 \text{ m}\Omega$ 以下 (終期)	嵌合したコネクタ -55°C / 30 分、85°C / 30 分 これを 1 サイクルとし5サイクル行う。 AMP 規格 109-5103 条件 A
3.5.13	Thermal Shock	$\Delta R=20 \text{ m}\Omega$ Max. (Final)	Mated connector -55°C / 30 min., 85°C / 30 min. Making this a cycle, repeat 5 cycles. AMP Spec. 109-5103 Condition A
3.5.14	温湿度サイクリング	絶縁抵抗 100 M Ω 以上 (終期) $\Delta R=20 \text{ m}\Omega$ 以下 (終期)	嵌合したコネクタ 25~65°C, 90~95 % R. H. 5 サイクル -10°C 寒冷衝撃 実施する AMP 規格 109-5106
3.5.14	Humidity-Temperature Cycling	Insulation resistance 100 M Ω Min. (final) $\Delta R=20 \text{ m}\Omega$ Max. (Final)	Mated connector, 25~65°C, 90~95 % R. H. 5 cycles Cold shock -10°C performed AMP Spec. 109-5106
3.5.15	塩水噴霧	$\Delta R=20 \text{ m}\Omega$ 以下 (終期)	嵌合したコネクタ 5 % の塩水噴霧に 24 時間さらすこと。 AMP 規格 109-5101 条件 A
3.5.15	Salt Spray	$\Delta R=20 \text{ m}\Omega$ Max. (Final)	Subject mated connectors to 5 % salt concentration for 24 hours : AMP Spec. 109-5101 Condition A

Fig.1 (CONT.)

項目	試験項目	規 格 値	試 験 方 法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.16	工業ガス (SO ₂)	ΔR=20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタ SO ₂ ガス 10 ppm, 95 % R. H. 25°C, 24 時間 AMP 規格 109-5107 条件 A
3.5.16	Industrial Gas (SO ₂)	ΔR=20 mΩ Max. (Final)	Mated connector SO ₂ Gas : 10 ppm, 95 % R. H. 25°C, 24 hours AMP Spec. 109-5107 Condition A
3.5.17	温度寿命 (耐熱)	ΔR=20 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタ 85°C、期間 2日間 AMP 規格 109-5104-2
3.5.17	Temperature Life (Heat Aging)	ΔR=20 mΩ Max. (Final)	Mated connector 85°C, Duration :2 days AMP Spec. 109-5104-2

Fig. 1 (End)

4. 製品認定試験の試験順序

4. Product Qualification Test Sequence

試験項目	Test Items	試験グループ/Test Group													
		1	2(b)	3(b)	4	5	6	7(b)	8	9	10	11	12	13	14
		試験順序/Test Sequence (a)													
製品の確認検査	Examination of Product	1,7	1,5	1,5	1,3	1,3	1,5	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3
総合抵抗 (ローレベル)	Termination Resistance (Low Level)		2,4	2,4			2,4			2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
耐電圧	Dielectric withstanding Voltage	3,6													
絶縁抵抗	Insulation Resistance	2,5													
温度上昇	Temperature Rising														2
振動 (低周波)	Vibration (Low Frequency)		3												
衝撃 (通常試験)	Physical Shock(Normal Test)			3											
衝撃 (耐久試験)	Physical Shock(Durable Test)				2										
基板挿入力	P.C.Board Mating Force					2									
耐久性(繰り返し挿抜)	Durability (Repeated Mating/Unmating)						3								
はんだ付け性	Solderability							2							
リフロー耐熱性	Resistance to Reflow Soldering Heat								2						
熱衝撃	Thermal Shock									3					
温湿度サイクリング	Temperature-Humidity Cycling	4												3	
塩水噴霧	Salt Spray										3				
工業ガス (SO ₂)	Industrial Gas (SO ₂)											3			
温度寿命 (耐熱)	Temperature Life (Heat Aging)												3		

FIG.2

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

(b) この試験グループには試験中不連続導通が発生してはならない。

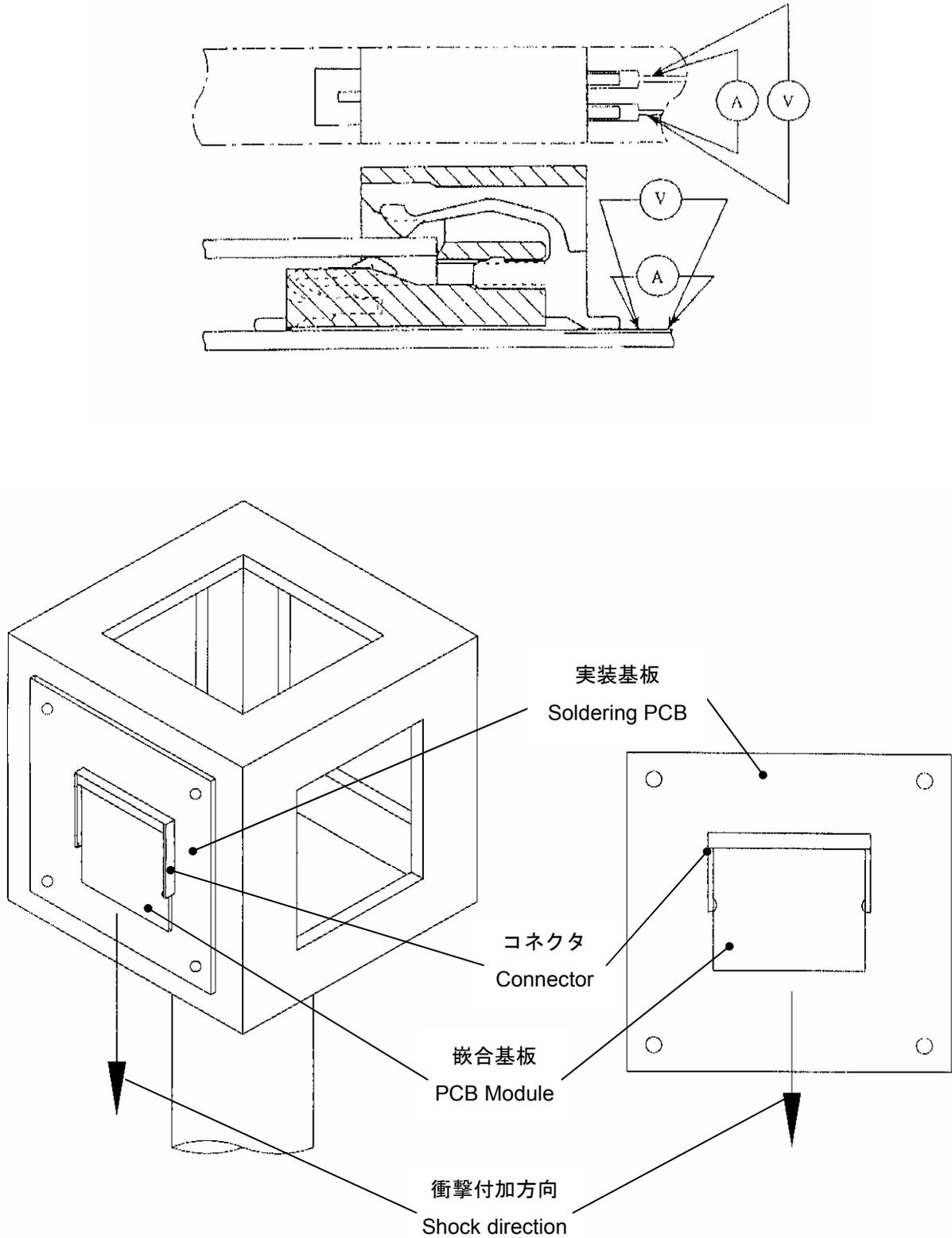


Fig. 3-2 衝撃試験 (耐久試験)

Fig3-2 PhysicalShock (Durable tetst)

作成 T. Kawamae 05-Jul-'05
 (Prepared by) 川前 貴裕 T.Kawamae Date
 コンピュータ&コンシューマーエレクトロニクス
 新製品開発統括部
 New Product Development & Engineering
 Computer & Consumer Electronics

検閲 T. Sasaki 05-Jul-'05
 (Checked by) 佐々木 滝紀 T. Sasaki Date
 コンピュータ&コンシューマーエレクトロニクス
 新製品開発統括部
 New Product Development & Engineering
 Computer & Consumer Electronics

承認 T. Sasaki 05-Jul-'05
 (Approved by) 佐々木 滝紀 T. Sasaki Date
 コンピュータ&コンシューマーエレクトロニクス
 新製品開発統括部
 New Product Development & Engineering
 Computer & Consumer Electronics

改訂 LTR	改訂記録 REVISION RECORD	作成 DR	検閲 CHK	承認 APVD	年月日 DATE
A	制定	T.K	T.S	T.S	05JUL'05